

| 特許の名称 | 発明者 | 出願番号 (出願年月日) | 公開番号 (公開年月日) | 登録番号 (登録年月日) | 実施許諾 |
|---|------|---------------------------|----------------------------|-----------------|------|
| カラーパターン光投影を用いた三次元形状計測法及び三次元形状測定装置 | 佐藤辰雄 | 2000-147232 (H12.5.19) | 2001-330417 (H13.11.30) | | |
| <p>権利の内容</p> <p>【課題】物体の三次元形状を非接触で行い、高い空間解像度で高精度に計測する三次元形状計測方法と三次元形状計測装置を提供する。</p> <p>【解決手段】いろあいが直線的かつ単調に増減するように設計したパターン光を投射するカラーパターン投射装置1と、そのカラーパターンが投射された物体を撮影するカラー画像撮影装置2、撮影したカラー画像と投射パターンの情報から三次元座標を計算する演算装置3から構成される装置を用い、等間隔にN等分ずつ循環的に位相をずらしたN通りのパターン光を順次投射してN枚のカラー画像を取得し、これらの画像を位相を元に戻してから加算合成し、得られた合成画像のすべての画素についてアクティブステレオ法に基づき物体座標系の三次元座標を求めて、物体の三次元形状を生成する。</p> <p>【特許請求の範囲】</p> <p>【請求項1】投射方向毎にいろあいの異なる、広がりを持ったカラーパターンを空間に投射するカラーパターン投射装置と、そのカラーパターンが投影された物体を撮影するカラー画像撮影装置、撮影したカラー画像と投射パターンの情報から三次元座標を計算する演算装置から構成される装置を用い、カラー画像中任意の点の画像座標と、その点の画像データのいろあいから計算により復元されるプロジェクタ座標とから、アクティブステレオ法または三角測量法に基づき物体の三次元座標を計算して求めることにより、物体の三次元形状を計測することを特徴とする三次元形状計測法および三次元形状計測装置。ほか請求項2まで。</p> | | | | | |